

OBSAH

1	ÚVOD	5
2	STANOVENÍ PARAMETRŮ TENKÝCH VRSTEV: OD BODU K PLOŠE PŘI <i>in situ</i> A <i>ex situ</i> MĚŘENÍCH	7
2.1	Zobrazovací <i>in situ</i> reflektometrie: nástroj ke studiu optických vlastností tenkých vrstev . . .	8
2.2	<i>In situ</i> měření spektrální odrazivosti v jednom bodě vzorku	11
2.3	<i>In situ</i> měření spektrální odrazivosti na ploše vzorku	11
3	MAGNETOOPTICKÝ KERRŮV JEV: NÁSTROJ KE STUDIU MAGNETICKÝCH VLASTNOSTÍ TENKÝCH VRSTEV	16
3.1	Měření longitudinálního Kerrova jevu v jednom bodě povrchu	18
3.2	Měření longitudinálního Kerrova jevu na ploše vzorku: zobrazování magnetických domén .	19
3.3	Příprava magnetických nanostruktur pomocí selektivního růstu a jejich vizualizace	21
4	PEDAGOGICKÁ ČINNOST	23
4.1	Tvorba systému studijních opor výuky fyziky: <i>e-learning</i>	23
4.2	Výuka v předmětech oborového studia <i>Fyzikální inženýrství</i>	23
5	ZÁVĚR	24
	PODĚKOVÁNÍ	25
	LITERATURA	25
	PŘEDSTAVENÍ AUTORA	28
	ABSTRACT	30